



MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN QUÍMICA APLICADA

ESPECIALIDAD “MÉTODOS AVANZADOS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES” (UMA)

Cuatrimestre	Código	Asignatura	Identificador	Créditos
1	620021	Análisis de imagen y nanoinspección	AIN	4
1	620022	Estudio de materiales por difracción de rayos X y XPS	RXPS	4
2	620023	Aplicación de técnicas de resonancia a materiales	ATRM	4
2	620024	Análisis de superficies e interfaces mediante láser	ASIL	4
2	620025	Espectroscopía vibracional y electrónica para la caracterización de materiales	EVECM	4

1 Crédito = 7.5 horas presenciales

Primer Cuatrimestre (Aula ¿?)

Horas	Lunes 14 de octubre	Martes 15 de octubre	Miércoles 16 de octubre	Jueves 17 de octubre	Viernes 18 de octubre
15.00 – 16.30	AIN	AIN	AIN	AIN	
16.30 – 18.00	RXPS	RXPS	RXPS	RXPS	

Horas	Lunes 21 de octubre	Martes 22 de octubre	Miércoles 23 de octubre	Jueves 24 de octubre	Viernes 25 de octubre
15.00 – 16.30	AIN	AIN	AIN	AIN	
16.30 – 18.00	RXPS	RXPS	RXPS	RXPS	

Horas	Lunes 28 de octubre	Martes 29 de octubre	Miércoles 30 de octubre	Jueves 31 de octubre	Viernes 1 de noviembre
15.00 – 16.30	AIN	AIN	AIN	AIN	TODOS LOS SANTOS
16.30 – 18.00	RXPS	RXPS	RXPS	RXPS	

Horas	Lunes 4 de noviembre	Martes 5 de noviembre	Miércoles 6 de noviembre	Jueves 7 de noviembre	Viernes 8 de noviembre
15.00 – 16.30	AIN	AIN	AIN	AIN	
16.30 – 18.00	RXPS	RXPS	RXPS	RXPS	

Horas	Lunes 11 de noviembre	Martes 12 de noviembre	Miércoles 13 de noviembre	Jueves 14 de noviembre	Viernes 15 de noviembre
15.00 – 16.30	AIN	AIN	AIN	AIN	SAN ALBERTO
16.30 – 18.00	RXPS	RXPS	RXPS	RXPS	